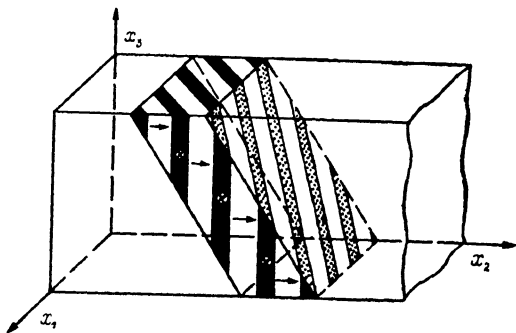


УСЛОВИЕ ДВОЙНИКОВАНИЯ СЕГНЕТОФАЗЫ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В МНОГООСНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ

В. Г. Гавриляченко, А. Ф. Семенчев, Е. Г. Фесенко

Фазовые переходы (ФП) в многоосных сегнетоэлектрических кристаллах имеют общие черты с мартенситными превращениями. Это обусловлено тем, что дальное действие сил электростатической природы снимается образованием в сегнетофазе (СФ) 180° -ных доменов и экранировавшем поляризации P_s свободными носителями зарядов^[1], поэтому форму равновесных зародышей новой фазы и кинетику ФП определяют процессы релаксации внутренних механических напряжений. Из теории гетерофазных структур^[2] следует, что наилучшему согласованному фаз отвечает пластинчатый зародыш СФ, оптимально ориентированный и сдвойникованный. Однако для того, чтобы зародыш был сдвойникован, он должен испытывать механические напряжения, достаточные для преодоления предела упругости. Найдем условие двойникования пластинчатого зародыша тетрагональной СФ в матрице кубической парафазы (ПФ), схематически представленного на рисунке.



Полидоменная сегнетоэлектрическая пластина в параэлектрической матрице. Направления P_s показаны стрелками.

Согласно [3, 4] на такой зародыш действуют электрострикционные механические напряжения, обусловленные влиянием матрицы

$$\sigma_n = c_{np} \xi_p \quad (n, p = 1 \dots 6), \quad (1)$$

где c_{np} — модули упругости ПФ, ξ_p — индуцированная деформация. Все компоненты тензора σ_n , кроме σ_4 и σ_6 , отличаются от нуля. Индуцированные деформации, испытываемые зародышем, связаны со скачком спонтанной поляризации при ФП ΔP_s следующим образом:

$$\xi_p = A_{pm} (\Delta P_s)_m^2 \quad (p, m = 1 \dots 6). \quad (2)$$

В (2) A_{pm} — перенормированные упругим взаимодействием электрострикционные коэффициенты. Они являются сложной функцией модулей упругости и коэффициентов электрострикции кристалла, а также зависят от концентрации двойников и ориентации пластины [3, 4].

Двойникование можно представить как потерю устойчивости СФ с одним направлением P_s (по x_2) по отношению к СФ с другим направлением P_s (по x_1) в поле механических напряжений. Запишем разложение термодина-

мического потенциала по поляризации в полярных координатах [5], где компоненты P_s составляют $P_1 = P_s \sin \omega$, $P_2 = P_s \cos \omega$, $P_3 = 0$, а ω — угол между P_s и x_2

$$\Phi = \Phi_0 + \alpha_1 P_s^2 \sin^2 \omega + \alpha_2 P_s^2 \cos^2 \omega + (\beta_1 P_s^4 / 2) + (\gamma_1 P_s^6 / 3) + (\beta_2 + \gamma_2 P_s^2) P_s^4 \sin^2 \omega \cos^2 \omega, \quad (3)$$

где

$$\alpha_1 = \alpha - (Q_{11}\sigma_1 + Q_{12}\sigma_2), \quad \alpha_2 = \alpha - (Q_{11}\sigma_2 + Q_{12}\sigma_1).$$

В (3) α , β_1 , β_2 , γ_1 , γ_2 — коэффициенты разложения $\Phi(P)$ по [5]; Q_{11} , Q_{12} — коэффициенты электрострикции.

Устойчивость выбранного нами состояния, где $P_2 = P_s$, а $P_1 = P_3 = 0$, нарушается при таком соотношении между σ_2 и σ_1 , которое соответствует условию

$$\partial^2 \Phi / \partial \omega^2 = 0, \quad (4)$$

откуда следует, что

$$\sigma_2 - \sigma_1 = -(\beta_2 + \gamma_2 P_s^2) P_s^2 / (Q_{11} - Q_{12}). \quad (5)$$

Используем выражение для диэлектрической проницаемости механически свободного кристалла, определяемой поперек полярной оси ε_{11}^0 [6], и упростим (5)

$$\sigma_2 - \sigma_1 = -2\pi / \varepsilon_{11}^0 (Q_{11} - Q_{12}). \quad (6)$$

Перейдем от (6) с учетом (4) к соотношению между индуцированными деформациями

$$\xi_2 - \xi_1 = -2\pi / \varepsilon_{11}^0 (Q_{11} - Q_{12}) (c_{11} - c_{12}). \quad (7)$$

Из (7) можно определить условие двойникового зародышей СФ, которое накладывается на величину скачка спонтанной деформации при ФП $\Delta \xi_s$. Для этой цели используем связь между $\Delta \xi_s$ и ΔP_s : $\Delta \xi_{si} = Q_{ik} (\Delta P_s)_k$ ($i, k = 1 \dots 6$) и выразим индуцированные деформации ξ_2 и ξ_1 с учетом (2) через $\Delta \xi_s$, A_{pm} и Q_{ik} . Далее введем коэффициент $r = A_{22} / A_{12}$ и учтем, что $A_{12} = -Q_{12}$ [4]. В результате для компонент $\Delta \xi_s^0$ поперек и вдоль полярной оси получим

$$\Delta \xi_{s1}^0 = -2\pi / \varepsilon_{11}^0 (1 - r) (c_{11} - c_{12}) (Q_{11} - Q_{12}), \\ \Delta \xi_{s3}^0 = \Delta \xi_{s1}^0 (Q_{11} / Q_{12}). \quad (8)$$

Таким образом, если в кристалле $\Delta \xi_s \gg \Delta \xi_s^0$, то СФ должна двойниковаться, а при $\Delta \xi_s < \Delta \xi_s^0$ двойники не будут возникать.

Для оценок выберем кристаллы PbTiO_3 (ТС), BaTiO_3 (ТБ) и $\text{KTa}_{0.65}\text{Nb}_{0.35}\text{O}_3$ (КТН), в которых перекрывается широкий интервал значений $\Delta \xi_s$ ($\Delta \xi_{s1} = -3.7 \cdot 10^{-3}$ в ТС, $-1.33 \cdot 10^{-3}$ в ТБ, $-5.4 \cdot 10^{-5}$ в КТН). Вычисления $\Delta \xi_{s1}^0$ по данным, приведенным в [1, 3, 4], дают следующие значения величин: $-7.8 \cdot 10^{-4}$ в ТС, $-2.75 \cdot 10^{-4}$ в ТБ, $-1.37 \cdot 10^{-4}$ в КТН. Из сравнения $\Delta \xi_{s1}$ и $\Delta \xi_{s1}^0$ следует, что в ТС и ТБ $\Delta \xi_{s1} > \Delta \xi_{s1}^0$, а в КТН $\Delta \xi_{s1} < \Delta \xi_{s1}^0$. Это объясняет опытные данные о двойниковании СФ выбранных кристаллов при ФП.

Список литературы

- [1] Фесенко Е. Г., Гавриляченко В. Г., Семенчев А. Ф., Юфатова С. М. // ФТТ. 1985. Т. 22. № 5. С. 1194—1200.
- [2] Ройтбурд А. Л. // УФН. 1974. Т. 113. № 1. С. 69—104.
- [3] Турик А. В., Чернобабов А. И., Тополов В. Ю. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 12. С. 3618—3621.
- [4] Турик А. В., Тополов В. Ю., Чернобабов А. И. // Деп. в ВИНТИ. 1986. № 269-В86.
- [5] Холоденко Л. П. Термодинамическая теория сегнетоэлектриков типа титаната бария. Рига: Зинатне, 1971. 227 с.

Ростовский государственный университет
НИИФ
Ростов-на-Дону

Поступило в Редакцию
14 марта 1989 г.
В окончательной редакции
21 июля 1989 г.